(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 15. April 2004 (15.04.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/031996 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation7: G06F 17/50
- (21) Internationales Aktenzeichen:
- PCT/DE2003/003208
- (22) Internationales Anmeldedatum:
 - 26. September 2003 (26.09.2003)
- (25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 45 452.3 27. September 2002 (27.09.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GLIESE, Dagmar [DE/DE]; Am Glockenbach 9, 80469 München (DE) EINSPENNER, Jürget [DE/DE]; Diakon-Kerolt-Weg 3, 81737 München (DE). ZIEBELL, Herbert-Arndt [DE/DE]; Schützenring 37, 93087 Alteglofsheim (DE).
- (74) Anwalt: SCHWEIGER, Martin; Schweiger & Partner, Karl-Theodor-Str. 69, 80803 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, SG, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

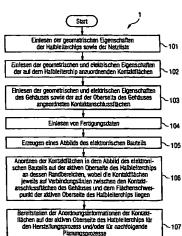
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: METHOD FOR DETERMINING THE POSITIONING OF CONTACT SURFACES ON THE ACTIVE UPPER FACE OF A SEMICONDUCTOR CHIP
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM BESTIMMEN DER ANORDNUNG VON KONTAKTFLÄCHEN AUF DER AKTIVEN **OBERSEITE EINES HALBLEITERCHIPS**



- twork list doed of the ged etric and electric characteristics of the contact surfaces that are to be positioned on the semiconductor chip
- upload of the geometric and electric characteristics of the housing in addition to the contact connection surfaces that are positioned on the up
- contact connection surfaces that are positioned on the upper face of the hor-upbead of production data creation of an image of the electronic component positioning of the contact surfaces in the image of the electronic component border areas of the active upper face of the semiconductor chip, said contact surfaces high grespectively on connection fixes between the contact connect surfaces of the housing and the centroid of the ective upper face of the consequent with the control of the con
- semiconductor chip

 107...provision of the positioning information of the contact surfaces on the active upper
 face of the semiconductor chip for the production porcess and/or for subsequent
- A...End



- (57) Abstract: The invention relates to a method for determining the positioning of contact surfaces on the active upper face of a semiconductor chip that is located in or on a housing. According to said method, semiconductor chip data, contact surface data, housing data and production data are first uploaded and an image of an electronic component is determined from said data. The positioning of the contact surfaces in said image of the electronic component is then determined. The contact surface positioning data that has been determined in this manner is then made available for subsequent production and/or design processes.
- (57) Zusammenfassung: Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren zum Bestimmen der Anordnung von Kontaktflächen auf der aktiven Oberseite eines in oder auf einem Gehäuse angeordneten Halbleiterchips werden zunächst Halbleiterchipdaten, Kontaktflächendaten, Gehäusedaten und Fertigungsdaten eingelesen, aus denen dann ein Abbild eines elektronischen Bauteils bestimmt wird. Dann wird die Anordnung der Kontaktflächen in diesem Abbild des elektronischen Bauteils bestimmt. Die so bestimmten Kontaktflächenanordnungsdaten werden für nachfolgende Herstellungs- und/oder Entwurfsprozesse bereitgestellt.



Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der f\u00fcr \u00e4nderungen der Anspr\u00fcche geltenden Frist; Ver\u00f6ffentlichung wird wiederholt, falls \u00e4nderungen eintreffen
- (88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 24. Juni 2004

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen. A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G06F17/50

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7-606F-H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, INSPEC, COMPENDEX, PAJ

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Α .	US 6 405 357 B1 (CHAO TE TSUNG ET AL) 11 June 2002 (2002-06-11) column 1, line 18 - column 2	1-13
A	US 6 357 036 B1 (MARTINEZ III MARCELLO R ET AL) 12 March 2002 (2002-03-12) column 4, line 23 - column 5, line 47 figures 1,2	1-13
A	US 5 331 572 A (TAKAHASHI NAOYA) 19 July 1994 (1994-07-19) column 2, line 13 - line 44 figure 3	1-13
A	US 5 498 767 A (CASTO JAMES J ET AL) 12 March 1996 (1996-03-12) abstract	1-13

X Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents: A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E* earlier document but published on or after the international filling date L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means P* document published prior to the international filling date but later than the priority date claimed	 *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. *&* document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 16 April 2004	Date of mailing of the international search report 22/04/2004
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Rijswrijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Authorized officer Guingale, A



PC1/DE 03/03208

C.(Continuat	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
	Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
A	US 5 608 638 A (TAIN ALEXANDER C ET AL) 4 March 1997 (1997-03-04) column 4, line 66 - column 5, line 24	1-13	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

on on patent family members

In	ona	d Application No
P	L DE	03/03208

Patent document cited in search rep	•	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 6405357	B1	11-06-2002	NONE		
US 6357036	B1	12-03-2002	NONE		
US 5331572	Α	19-07-1994	JP JP	2720629 B2 4328847 A	04-03-1998 17-11-1992
US 5498767	A	12-03-1996	NONE		
US 5608638	Α	04-03-1997	JP	8288333 A	01-11-1996

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G06F17/50

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) GO6F HO1L IPK 7

Recherchlerte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, INSPEC, COMPENDEX, PAJ

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Α	US 6 405 357 B1 (CHAO TE TSUNG ET AL) 11. Juni 2002 (2002-06-11) Spalte 1, Zeile 18 - Spalte 2	1-13
A .	US 6 357 036 B1 (MARTINEZ III MARCELLO R ET AL) 12. März 2002 (2002-03-12) Spalte 4, Zeile 23 - Spalte 5, Zeile 47 Abbildungen 1,2	1-13
A	US 5 331 572 A (TAKAHASHI NAOYA) 19. Juli 1994 (1994-07-19) Spalte 2, Zeile 13 - Zeile 44 Abbildung 3	1-13
A	US 5 498 767 A (CASTO JAMES J ET AL) 12. März 1996 (1996-03-12) Zusammenfassung	1-13

 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A" Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	 *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolitidert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
16. April 2004	22/04/2004
Name und Postanschrift der Interm-flonalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter
NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31–70) 340–3016	Guingale, A
Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Januar 2004)	

Slehe Anhang Patentfamilie

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

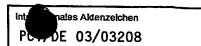
Int males Aktenzelchen
PC_DE 03/03208

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		03/03208	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	nden Teile Betr. A	Anspruch Nr.	
4	US 5 608 638 A (TAIN ALEXANDER C ET AL) 4. März 1997 (1997-03-04) Spalte 4, Zeile 66 - Spalte 5, Zeile 24		1-13	
	,			
,				
nblatt PCT/I	SA/210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Januar 2004)	<u>.</u>		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen

selben Patentfamilie gehören



Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
US 6405357	B1	11-06-2002	KEINE			
US 6357036	B1	12-03-2002	KEINE			
US 5331572	A	19-07-1994	JP JP	2720629 B2 4328847 A	04-03-1998 17-11-1992	
US 5498767	Α	12-03-1996	KEINE			
US 5608638	A	04-03-1997	JP	8288333 A	01-11-1996	